

NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD

CEI
IEC

60748-11

QC 790100

1990

AMENDEMENT 2
AMENDMENT 2
1999-04

Amendement 2

**Dispositifs à semiconducteurs –
Circuits intégrés –**

**Onzième partie:
Spécification intermédiaire pour les circuits
intégrés à semiconducteurs
à l'exclusion des circuits hybrides**

Amendment 2

**Semiconductor devices –
Integrated circuits**

**Part 11:
Sectional specification for semiconductor
integrated circuits excluding hybrid circuits**

© IEC 1999 Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved

International Electrotechnical Commission
Telefax: +41 22 919 0300

3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
e-mail: inmail@iec.ch IEC web site <http://www.iec.ch>



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Le présent amendement a été établi par le sous-comité 47A: Circuits intégrés, du comité d'études 47 de la CEI: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47A/536/FDIS	47A/551/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 24 (voir l'amendement 1)

Tableau II – Groupe A: Contrôles lot par lot

Dans la note 3, ajouter ce qui suit:

«Dans un tel cas, lorsque l'essai duplique celui d'un autre sous-groupe, il n'a pas besoin d'être répété.»

Page 26 (voir l'amendement 1)

Tableau III – Groupe B: Contrôles lot par lot

Supprimer le texte existant de la note 4, qui est ambiguë, et le remplacer par ce qui suit:

«La spécification particulière cadre peut diminuer l'exigence des essais des sous-groupes A3, A3a et A3b à celle d'un seul sous-groupe.»

Page 28 (voir amendement 1)

Tableau IV – Groupe C: Contrôles périodiques

Dans la colonne «Conditions» pour le sous-groupe C9, supprimer l'indication «Méthode 1» qui n'existe pas et la remplacer par ce qui suit:

«Temps et température à spécifier dans les spécifications intermédiaires et de détail.»

FOREWORD

This amendment has been prepared by subcommittee 47A: Integrated circuits, of IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this amendment is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47A/536/FDIS	47A/551/RVD

Full information on the voting of the approval of this amendment can be found in the report on voting indicated in the above table.

Page 25 (see amendment 1)

Table II – Group A: Lot-by-lot

In note 3, add the following:

"In such a case, where the test duplicates that of another subgroup, this test need not be repeated."

Page 27 (see amendment 1)

Table III – Group B: Lot-by-lot

Delete the existing wording of note 4, which is ambiguous, and substitute the following:

"The blank detail specification can reduce the requirement for subgroup testing in A3, A3a and A3b to a minimum of one subgroup."

Page 29 (see amendment 1)

Table IV – Group C: Periodic tests

Under "Details and conditions" for subgroup C9, delete "Method 1" which is non-existent, and substitute the following:

"Time and temperature to be specified either in the sectional or in the detail specification."

Tableau VII – Exigences de prélèvement pour les essais du Groupe A

Remplacer le tableau existant par le nouveau tableau suivant:

Sous- groupe	NQT (note 10)			NQA					
	Catégorie	Catégorie	Catégorie	Catégorie I		Catégorie II		Catégorie III	
	I	II	III	NC	NQA	NC	NQA	NC	NQA
A1	7	3	3	II	1,0	II	0,4	II	0,4
A2	1	0,7	0,7	II	0,15	II	0,1	II	0,1
A2a	–	3	3	–	–	II	0,4	II	0,4
A2b	–	3	3	–	–	II	0,4	II	0,4
A3	5	2	2	II	0,65	II	0,25	II	0,25
A3a	10	3	3	S4	1,5	S4	0,4	S4	0,4
A3b	20	3	3	S4	2,5	S4	0,4	S4	0,4
A4	10	5	5	S4	1,5	S4	0,65	S4	0,65
A4a	–	7	7	–	–	S4	1,0	S4	1,0
A4b	–	7	7	–	–	S4	1,0	S4	1,0

NOTE 10 – Niveau de qualité toléré, avec un critère d'acceptation maximal de 4.